



# Образец с атомно-молекулярным калиброванным рельефом для коррекции измерений в нанодиагностике

Определение линейных размеров высот в субнанометровом диапазоне

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Атомно-силовая микроскопия
- Электронно-зондовая микроскопия

## КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Высота ступеней является параметром кристаллической структуры, значение которого известно, поэтому искажения, связанные с взаимодействием других сил (ван-дер-ваальсовых, кулоновских и пр.), могут быть учтены

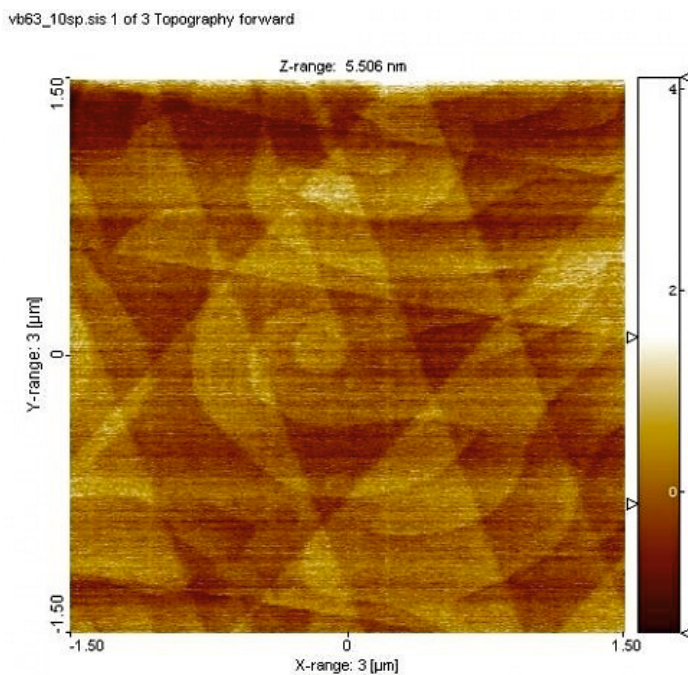
## СТАДИЯ РАЗРАБОТКИ

Изготовлен макет на основе теллурида свинца

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Калиброванные значения высот выступов на поверхности:

- 0,375 нм
- 0,75 нм
- 1,125 нм
- 1,5 нм
- 1,875 нм



Общий вид макета образца теллурида свинца с калиброванной высотой 0,375 нм и 0,75 нм